



一种全场X射线成像系统及成像方法

文献类型: 专利

作者 邓彪; 杜国浩; 佟亚军; 陈荣昌; 丰丙刚; 肖体乔

发表日期 2016-07-27

专利号 CN105806860A

著作权人 中国科学院上海应用物理研究所

国家 中国

文献子类 发明专利

英文摘要 本发明涉及一种全场X射线成像系统及成像方法, 其中所述系统包括: X射线光源; 铅准直器, 其对所述X射线光源输出的X射线进行限束以输出X射线锥束; 设置在所述铅准直器输出侧的用于放置样品的样品台; X射线成像探测器, 其探测从所述样品透射出的X射线, 并获得一组X射线显微CT投影数据; X射线成像光谱仪, 其探测所述样品激发的特征X射线荧光, 并获得一组X射线荧光CT投影数据; 以及与所述X射线成像探测器和所述X射线成像光谱仪连接的数据处理装置。采用本发明可以同时实现X射线荧光CT与显微CT全场成像, 获得样品中元素三维分布及内部结构信息。

公开日期 2016-07-27

申请日期 2016-03-08

语种 中文

源URL [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/33697>]

专题 上海应用物理研究所_中科院上海应用物理研究所2011-2017年

推荐引用方式 邓彪,杜国浩,佟亚军,等. 一种全场X射线成像系统及成像方法. CN105806860A. 2016-07-27.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览	下载	收藏
38	8	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。